

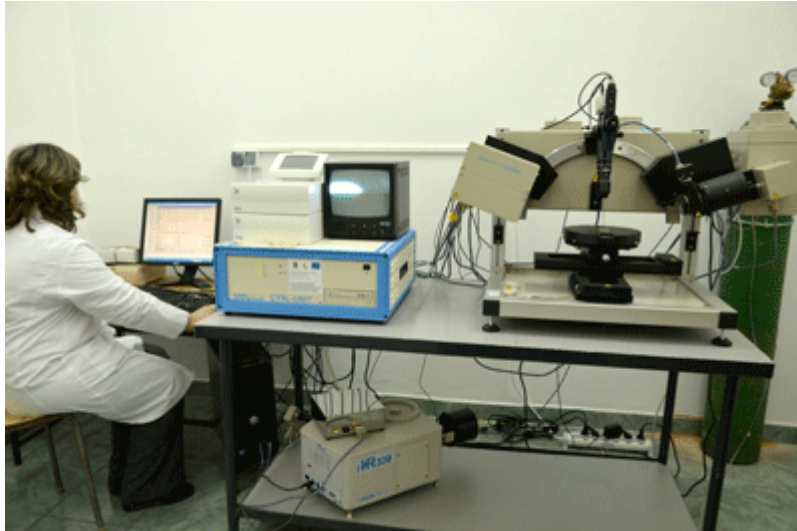
Elipsometru

UVISEL Model :IHR320FUV AGAS

Producator: HORIBA JOBIN YVON Franta

Furnizor: HORIBA JOBIN YVON Franta

Service: HORIBA JOBIN YVON Franta



Domeniu de utilizare:

Studiul straturilor subtile, materiale nanostructurate, oxizi micsti, structuri oxidice nanoporoase, interfete solid/lichid cu aplicatii in chimie si biologie.

Elipsometria furnizeaza, prin masuratori non-contact, informatii despre grosimea filmelor subtile si constantele optice ale acestora.

Parametrii functionali:

- Domeniu spectral: 190-2100 nm;
- Detector: monocromator de inalta rezolutie;
- Suport de proba cu dimensiunile 200x200 mm;
- Goniometru automat cu reglarea unghiului de la 40° la 90° cu un pas de 0,01°;
- Unitate de mapare a probei.

Accesorii:

- Celula de lichid simpla pentru studierea interfetelor solid/lichid;
- Celula electrochimica;
- Camera de control a temperaturii cu atmosfera controlata cu un domeniu de temperatura in intervalul -196°C pana la 600°C;
- Camera pentru vizualizarea probei
- Acuratete: $\Psi = 45^\circ \pm 0,02^\circ$ si $\Delta = 0^\circ \pm 0,02^\circ$ masurate in aer la 1,5-5 eV
- Repetabilitate: NIST 1000Å SiO₂/Si (190-2100 nm): $d \pm 0,1\%$; $n(632,8 \text{ nm}) \pm 0,0001$
- Masurarea matricii Mueller cu pana la 16 coeficienti;
- Software pentru calibrare, achizitie date si analiza.

